

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

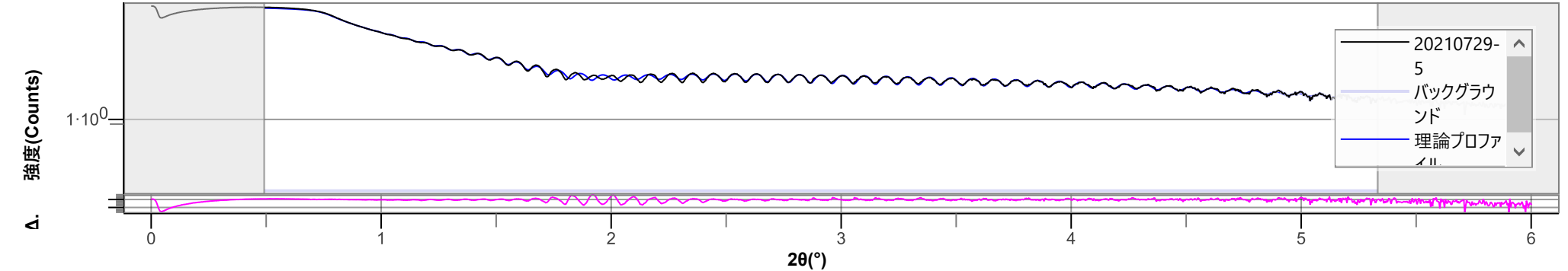
波長(nm): 0.1540593
点数: 1501
2θ(°):開始 = 0.000, 終了 = 6.000
ステップ = 0.004
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: Nelder-Mead
データ間隔:1点ごとにフィッティング
残差タイプ: |Δ(LogI)|
最大反復数: 500
許容誤差: 1.00e-015

装置関数: 擬Voigt関数
ローレンツ関数の比率: 0.00
ローレンツ幅: 1.00e-002
ガウス幅: 9.27e-003

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>		密度(g/cm³)<d>		粗さ(nm)<rg<		
	<input checked="" type="checkbox"/>	L5	Fe2O3	0.894	Const	3.15171	Const	1.123	Con...	
				±0.02	精密化	±0.017	精密化	±0.008	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	1.230	Const	4.37114	Const	0.300	Con...	
				±0.008	精密化	±0.008	精密化	±0.007	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe	0.978	Const	5.16544	Const	0.000	Con...	
				±7	精密化	±0.009	精密化	±0.02最小ー	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	89.999	Const	7.76729	Const	0.100	Con...	
				±0.014	精密化	±0.012	ー最大 精密化	±0.007最小ー	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	2.398	Const	4.44265	Const	0.718	Con...	
				±0.04	精密化	±0.03	精密化	±0.008	精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con...	